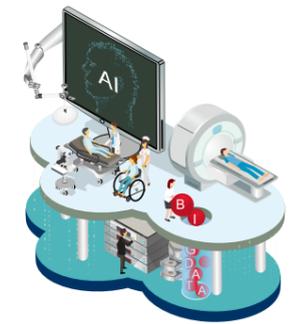


KOREA SENSOR LAB

KOREA *Korea* SENSOR *Sensor* LAB *Leader*



www.ksensor.co.kr

KSL 한국센서연구소
KOREA SENSOR LAB CO., LTD.

인간과 기기의 안전한 네트워크

KOLAS 국제공인시험기관(KT 614)

소재지 대전광역시 유성구 대학로 291 6층, 8층 (한국과학기술원 나노종합기술원)

부속시설 대전광역시 유성구 대학로 99 충남대학교 공대 2호관 273호

대표전화 Tel 042.936.5361 Fax 042.863.5361 E-mail support@ksensor.co.kr smlee@ksensor.co.kr

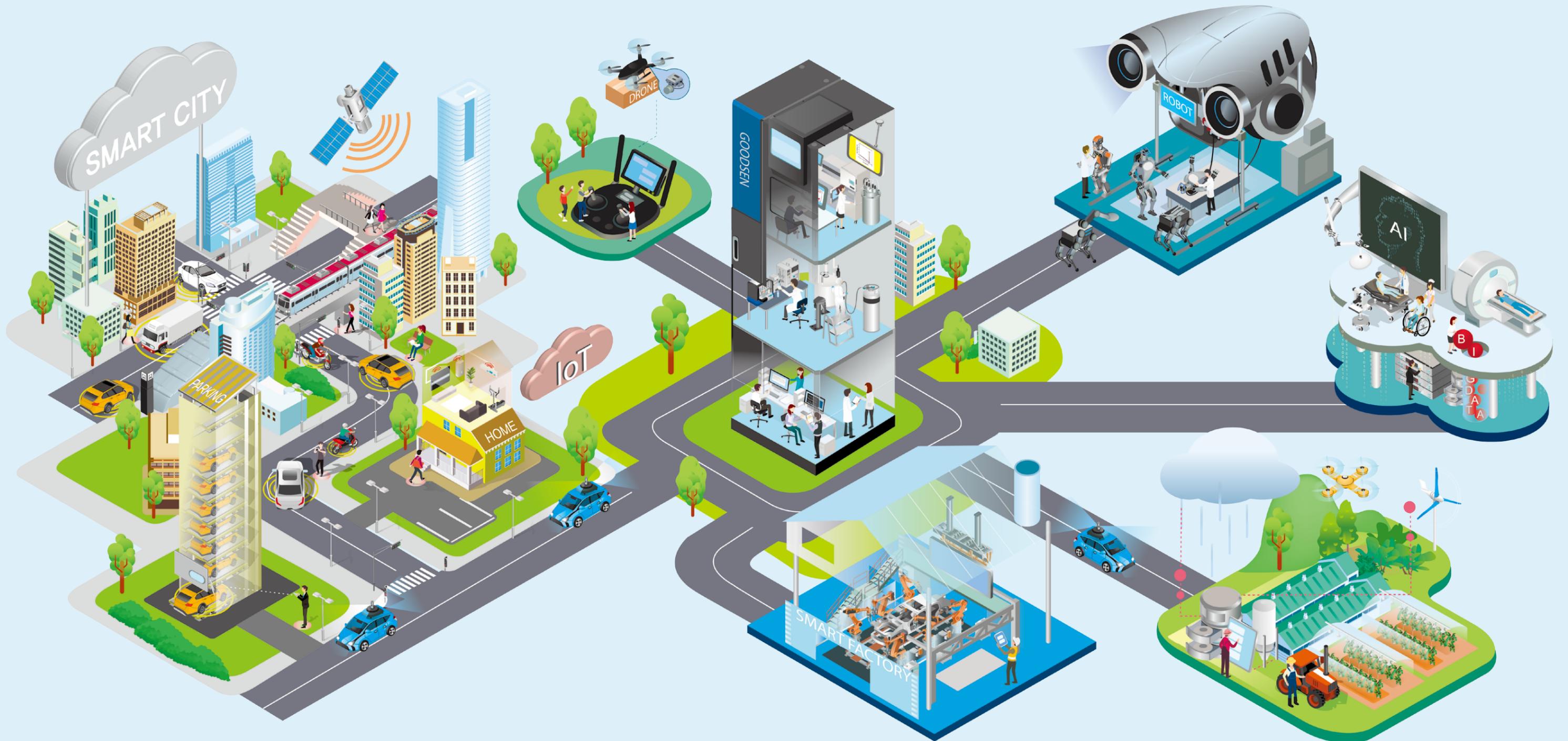
한국센서연구소

한국센서연구소

4차 산업 생태계 안에서 우리는 센서를 통해 끊임없이 연결됩니다.

Sensor로 움직이는 세상

한국센서연구소가 미래를 만듭니다.

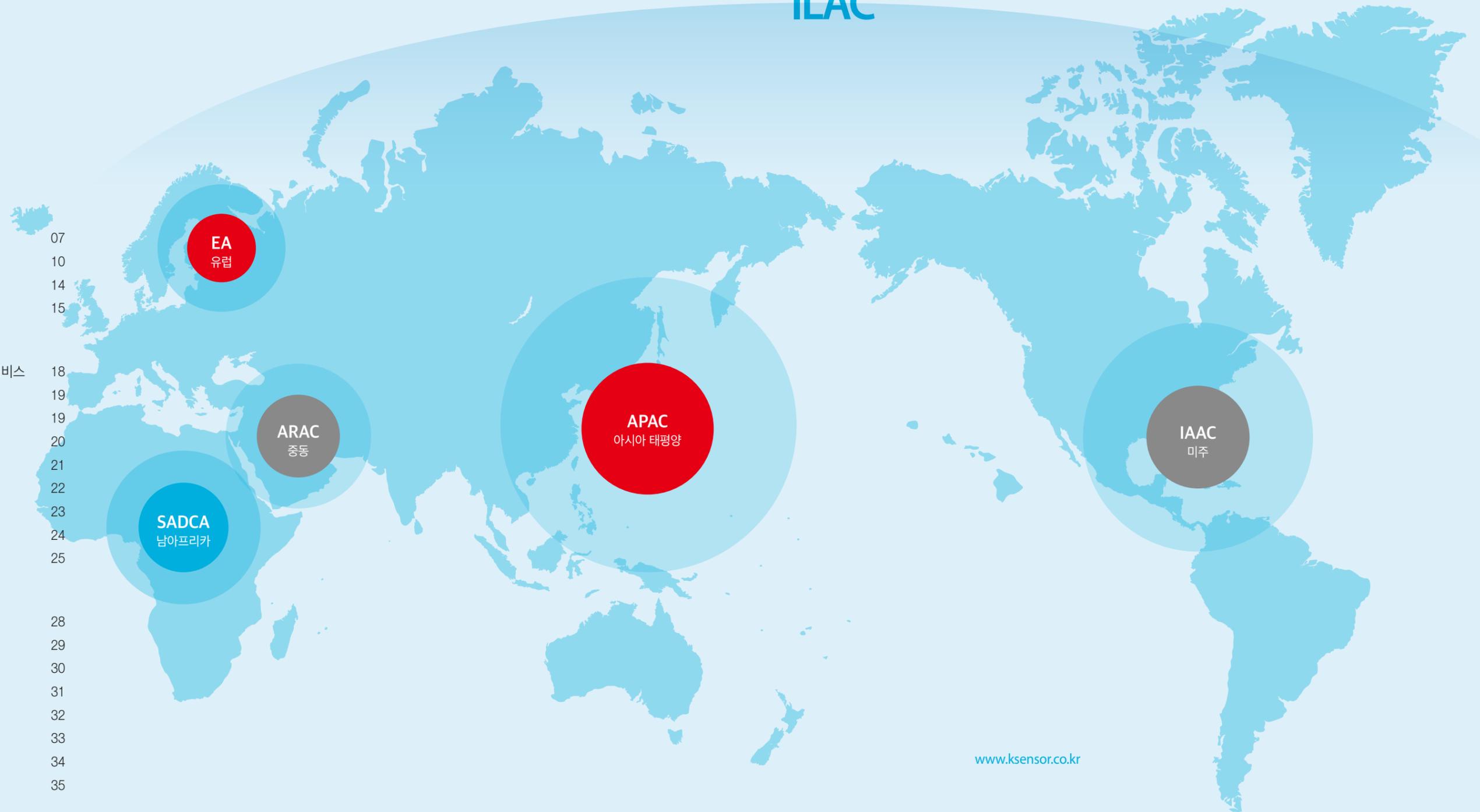


KOLAS
국제공인시험기관

ILAC

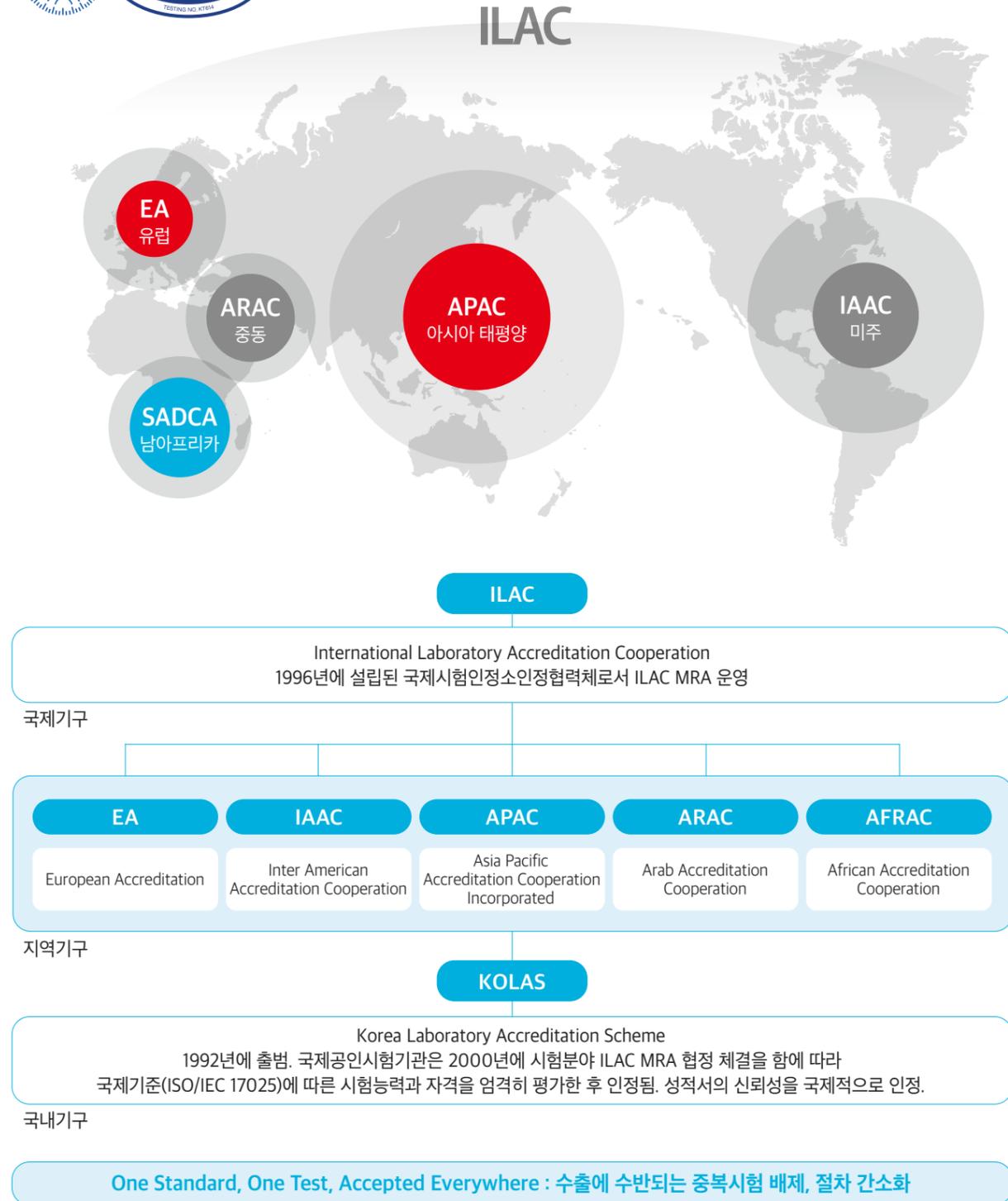
CONTENTS

 I KOLAS 국제공인시험기관	
01 국제공인시험인정 분야	07
02 시험분석서비스 분야	10
03 고품질성적서 필요성 및 활용성	14
04 고객의뢰절차	15
 II 연구개발서비스 전문기관	
01 반도체 WLR(Wafer Level Reliability) 서비스	18
02 AI 반도체 TEG 서비스	19
03 AI 반도체 공정서비스	19
04 1/f noise 시험분석서비스	20
05 세계최초개발, GOODSEN	21
06 스마트센서 국산화	22
07 스마트센서 표준화	23
08 스마트센서 제품화	24
09 스마트센서 플랫폼화	25
 III 우리들의 이야기	
01 대표이사 인사말	28
02 회사 성장 일기 : 연혁 및 수상실적	29
03 KOLAS 임원 인사말	30
04 조직도 및 회사비전	31
05 따스한 동행 : 우리들의 이야기	32
06 외부전문위원 (since 2022)	33
07 따스한 동행 : 이웃사랑	34
08 기업을 돕는 기업	35



KOLAS 국제공인시험기관(KT 614)

한국센서연구소 공인성적서는 103개국에 통용됩니다.



01 국제공인시험인정 분야

한국센서연구소 1/f Noise 기술은 세계최강입니다.



표준구분	표준명	출처	적용
국제표준(ISO)	Procedure for Measuring N-Channel MOSFET Hot-Carrier-Induced Degradation Under DC Stress	Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC)	반도체 소자 및 칩
국제표준(ISO)	Procedure for Measuring P-Channel MOSFET Negative Bias Temperature Instabilities	Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC)	반도체 소자 및 칩
국제표준(ISO)	Procedure for Characterizing Time-Dependent Dielectric Breakdown of Ultra-Thin Gate Dielectrics	Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC)	반도체 소자 및 칩
국내표준(TTA)	Evaluation method of bolometer film for infrared sensor: Part 1. Temperature Coefficient of Resistance	한국정보통신기술협회 (TTA)	센서
국내표준(TTA)	Evaluation method of bolometer film for infrared sensor: Part 2. 1/f noise	한국정보통신기술협회 (TTA)	센서
국제표준(ISO)	Procedure for Measuring P-Channel MOSFET Hot-Carrier-Induced Degradation Under DC Stress	Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC)	반도체 소자 및 칩
국제표준(ISO)	A Procedure for the Evaluation of Low-k/Metal Inter/Intra-Level Dielectric Integrity	Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC)	반도체 소자 및 칩
미국방성 (MIL-STD)	Department of Defense Test Method Standard Transistor Electrical Test Methods for Semiconductor Devices Part 3: Test Methods 3000 Through 3999 3001.1 Breakdown Voltage, Collector to Base 3005.1 Burnout by Pulsing 3011.2 Breakdown Voltage, Collector to Emitter 3026.1 Breakdown Voltage, Emitter to Base 3051 Safe Operating Area (Continuous DC) 3401.1 Breakdown Voltage, Gate-to-Source 3403.1 Gate-to-Source Voltage or Current 3404 MOSFET Threshold Voltage 3405.1 Drain-to-Source On-State Voltage 3407.1 Breakdown Voltage, Drain-to-Source 3411.1 Gate Reverse Current 3413.1 Drain Current 3415.1 Drain Reverse Current 3421.1 Static Drain-to-Source On-State Resistance	Military Standard, Department of Defense (U.S.A.)	반도체 소자 및 칩 & 센서
미국방성 (MIL-STD)	Department of Defense Test Method Standard Diode Electrical Test Methods for Semiconductor Devices Part 4: Test Methods 4 000 Through 4999 4011.4 Forward Voltage(3.2 Pulse method 제외) 4016.4 Reverse Current Leakage 4021.2 Breakdown Voltage (Diodes) 4076.1 Saturation Current 4141.1 Burn out By Repetitive Pulsing	Military Standard, Department of Defense (U.S.A.)	반도체 소자 및 칩 & 센서

01 국제공인시험인정 분야

한국센서연구소는 반도체 및 센서 KOLAS 국제공인 시험기관입니다.



표준구분	표준명	출처	적용			
미국방성 (MIL-STD)	Department of Defense Test Method Standard Electronic and Electrical Component Parts Class 100 Environment Test 103B Humidity (steady state) 106G Moisture resistance 107G Thermal shock 108A Life (At Elevated Ambient Temperature) Class 200 Physical-Characteristics Test 201A Vibration 204D Vibration, High Frequency Class 300: Electrical-Characteristics Tests 301 Dielectric Withstanding voltage 302 Insulation resistance 303A DC resistance 304 Resistance temperature characteristic 305A Capacitance 306 Quality factor 307 Contact Resistance 309 Voltage coefficient of resistance determination procedure	Military Standard, Department of Defense (U.S.A.)	반도체 소자 및 칩 & 센서			
	국내표준(TTA)			정보통신용 저항기의 주기적 전압 펄스에 의한 저항값의 변화량 평가 방법	한국정보통신기술협회 (TTA)	반도체 소자 및 칩 & 센서
	국내표준(TTA)			반도체 소자의 1/f 잡음평가 방법		
	국제표준(ISO)			Steady-State Temperature-Humidity Bias Life Test	Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC)	반도체 소자 및 칩 & 센서
	국제표준(ISO)			High Temperature Storage Life	Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC)	반도체 소자 및 칩 & 센서
	국제표준(ISO)			Low Temperature Storage Life	Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC)	
	국제표준(ISO)			Temperature Cycling	Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC)	반도체 소자 및 칩
	국제표준(ISO)			Temperature, Bias, and Operating Life	Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC)	반도체 소자 및 칩
	미국방성 (MIL-STD)			Department of Defense Test Method Standard ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS PART TWO - LABORATORY TEST METHODS 501.4 High Temperature 502.4 Low Temperature 503.4 Temperature Shock 507.4 Humidity	Military Standard, Department of Defense (U.S.A.)	반도체 소자 및 칩 & 센서
				국제표준(IEC)		

한국센서연구소 품질경영시스템은 국제표준을 충족하고 있습니다.



표준구분	표준명	출처	적용
미국방성 (MIL-STD)	Department of Defense Test Method Standard ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS PART TWO - LABORATORY TEST METHODS 501.7 High Temperature 502.7 Low Temperature 503.7 Temperature Shock 507.6 Humidity	Military Standard, Department of Defense (U.S.A.)	반도체 소자 및 칩 & 센서
	미국방성 (MIL-STD)		
국내표준(KS)	환경 시험 - 제2-1부: 시험 - 시험 A: 내한성 시험	한국표준협회	반도체 소자 및 칩 & 센서
국제표준(IEC)	Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold	International Electrotechnical Commission (IEC)	
국내표준(KS)	환경 시험 - 제2-2부: 시험 - 시험 B: 내열성 시험	한국표준협회	
국제표준(IEC)	Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat	International Electrotechnical Commission (IEC)	
국내표준(KS)	환경 시험 - 제 2-30부: 시험 - 시험 Db와 지침: 내습 사이클(12+12-h 사이클)	한국표준협회	
국제표준(IEC)	Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)	International Electrotechnical Commission (IEC)	
국내표준(KS)	환경 시험 - 제2-38부: 시험 - 시험 Z/AD: 합성 온도/습도 사이클 시험	한국표준협회	
국제표준(IEC)	Environmental Testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test	International Electrotechnical Commission (IEC)	
국내표준(KS)	환경 시험 - 제2-78부: 시험 - 시험 Cab: 안정 상태의 내습성 시험	한국표준협회	
국제표준(IEC)	Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state	International Electrotechnical Commission (IEC)	
국제표준(IEC)	Environmental testing Part 2: Tests — Test Cy: Damp heat, steady state, accelerated test primarily intended for components	International Electrotechnical Commission (IEC)	

- KOLAS 시험성적서는 상호인정협정(ILAC-MRA)에 가입한 103개 국가의 시험기관과 아시아-태평양 시험기관 인정 협력체 상호인정협정(APLAC-MRA)에 가입한 24개국 39개 시험기관에서 발행한 시험성적서와 동등한 효력을 갖습니다.

02 시험분석서비스 분야

한국센서연구소는 수준 높은 시험분석서비스를 제공합니다.



분야	세부항목	세부항목	
반도체 시험 분석	웨이퍼 및 칩 레벨 시험 분석	저주파노이즈 시험	포화전류 시험
		신뢰성 스트레스에 따른 저주파노이즈 평가	MOSFET 임계전압 시험
		전압-전류 특성 분석	전자이동도 시험
		커패시턴스 측정 분석	TCC 시험
		Q-Factor 측정 분석	TCR 시험
		Impedance 측정 분석	Disturb 특성 시험 분석
		Hot Carrier 시험 분석	Endurance 특성 시험 분석
		TDDB 신뢰성 시험 분석	Retention 특성 시험 분석
		NBTI 신뢰성 시험 분석	전압펄스에 의한 저항값 변화량 측정분석
		PBTI 신뢰성 시험 분석	파워 소자의 순방향 전류-전압 특성
		GOI 신뢰성 시험 분석	파워 소자의 역방향 누설 전류 특성
		MTTF 시험	항복 전압 시험
		SOA 분석 및 개선	Gate Charge 측정시험
		EM/SM 시험 분석	Back-gate를 이용한 소자 분석
		게이트 (역)전류 시험	Pulsed I-V 측정 분석
	드레인 (역)전류 시험	TTF 시험	
	순방향 전압 시험	Warping 측정	
	역전류 누설 시험	다층 SiF 밴딩 신뢰성 시험	
	환경 및 신뢰성 시험	고온 저장 시험	열충격 시험
		저온 저장 시험	HAST 시험
고온 동작 시험		온도 사이클 신뢰성 시험	
저온 동작 시험		습도 사이클 신뢰성 시험	
TFT소자/Flexible Display 소자	Bending 시험	GOI 등 신뢰성 시험	
	Back-gate를 이용한 소자 분석	Hall Effect 측정	
	전자이동도 등 주요 파라미터 추출		
수준 높은 분석 서비스	저주파 노이즈 시험 구분	저주파노이즈 성능개선	
	고주파 특성 평가 분석	반도체 소자의 고주파 특성 측정 및 분석	
	메모리 소자 특성평가분석	메모리 소자 및 제품 특성 평가분석	Retention 특성 평가분석
		DRAM 소자 및 제품 특성 평가분석	Threshold Voltage의 Endurance 특성 평가분석
		Flash Memory 소자 및 제품 특성 평가분석	Program & Erase cycle에 따른 소자 특성분석
		Embedded Memory 소자 및 제품 특성 평가분석	
	소자의 Self-heating 평가 분석	SOI/SOS 소자의 Self-heating 분석평가	Heterojunction 소자의 Self-heating 분석평가
		MOSFET/Power 소자의 Self-heating 분석평가	구동전류/Carrier Mobility/Speed 감소 분석평가
		High Current 소자의 Self-heating 분석평가	소자 신뢰성 특성저하/동작 특성 Modeling 불가능 평가
		High Voltage 소자의 Self-heating 분석평가	
	고온 및 저온에서 다양한 전기적 특성분석	고온에서의 다양한 전기적 특성분석(~200도)	저온에서의 다양한 전기적 특성분석
		온도에 따른 소자 및 센서의 특성변화 분석	온도 감소에 따른 소자 및 센서의 특성변화 분석
고온에서의 저주파노이즈 특성분석		저온에서의 저주파노이즈 특성분석	
Display 소자의 신뢰성평가	Amorphous TFT, LTPS TFT 소자의 신뢰성평가	Display 소자의 PBTI 신뢰성평가	
	OLED 소자, ZnO 소자의 신뢰성평가	Display 소자의 Mobile Ion 신뢰성평가	
	Display 소자의 Hot Carrier 신뢰성평가	Display 소자의 온도에 따른 특성 변화평가	
고속 신호 분석	Nano-second 이하 고속 신호 변화 분석	Pulse 발생 및 특성 분석	
	타이밍 및 평선 측정시험	오실로스코프 측정 불가능 영역 측정 분석	
배선의 신뢰성 시험평가	EM(Electro Migration) 특성 평가	SM(Stress Migration) 특성 평가	
불량 분석	반도체 소자의 신뢰성 불량분석	Dielectric 특성 분석	

한국센서연구소 신뢰성 기술이 반도체 및 센서의 성능을 높여줍니다.



분야	세부항목	세부항목	
수준 높은 분석 서비스	불량 분석	Gate Oxide의 불량분석	불량분석을 통해 수명 예측 가능
		계면 불량분석	소자 동작 중 불량분석
		Silicide 불량분석	소자 제작 공정의 불완전성 불량분석
		Junction Leakage 불량분석	메모리 소자 Stress에 의한 불량분석
		캐패시터 불량분석	메모리 소자 Noise에 의한 불량분석
		저항 불량분석	메모리소자 다양한 분석 통한 원인파악
		인덕터 불량분석	다양한 센서 불량분석
		기타 불량분석 서비스	
Test Wafer 및 공정 서비스 분야	Test Wafer 제작 서비스	초미세 패턴 쿠폰 웨이퍼 제작	ALD Films, Sputter Films 등 형성
		다양한 시험 분석을 위한 쿠폰 웨이퍼 제작	고객이 요구하는 구조의 Patterned Wafer 제공
		새로운 재료, 공정, 장비의 성능 평가용 Wafer제공	
	ALD 공정	고성능 초박막 증착	다양한 종류의 유전체 증착 가능
		Sputter 공정	RF/DC 스퍼터 증착 가능
	산화막 공정	Co-sputtering 가능	
		산화막 공정	SiO ₂ 산화막 형성
	Furnace/RTP Annealing	제작된 소자나 박막 등 고온에서의 특성변화 분석	열안정성 시험
최고 1000도까지 RTP/RTO 공정 가능		고순도 기체를 이용하여 대기압에서 열처리 병행	
고온고압시험	D ₂ , H ₂ 고온 고압 열처리	고온 고압 열처리 전후 특성 분석	
	Photo-lithography 공정	Positive PR/Negative PR 가능	Shadow MASK를 이용한 패턴 형성
반도체 및 전기전자 제품 시험 서비스	다양한 시험 분석 서비스	누설전류 시험	두께측정 시험
		외관검사 시험	측정범위, 오차 시험
		저항측정 시험	온도 정확도 시험
		거리측정 시험	저항 균일도 시험
		전류파라미터 측정시험	온도에 따른 저항 변화율 시험
		전압파라미터 측정시험	온도에 따른 임피던스 변화 시험
		타이밍 및 평선 측정시험	온도에 따른 순/역방향 특성 시험
		전력반도체(다이오드) 소자 측정	전력 증폭기 칩 전력부하효율(PAE) 시험
		동적범위 시험	미세유체 디바이스 기능 시험
		PMS 데이터(균열, 소성변형, IRI 검출 분해능력)측정	HEMT 소자의 성능 시험
		FOV(Field Of View) 측정 시험	MEMS 히터 동작온도 시험
		SIS 센서 측정 정밀도, 측정 불확도 평가 시험	무선통신 거리측정 시험
		열전전도 시험	Dielectric Constant 시험
		열용량 시험	Dissipation Factor 시험
		재현성 시험	무선통신 Data Rate 시험
		검출한계 시험	무선투과 Depth 측정
		히스테리시스 반복시험	Frame Rate 시험
		표면결함(균열) 감지성능 시험	충격시험
		분해능, 광원소모 소모전력 시험	분석효율 측정시험
		Cell V _t 측정	위치 정밀도 측정시험
		안정성 수명 시험	유량레벨 정밀도 측정시험
		접촉특성(저항) 시험	APP, 장비출력값 확인 시험
		양불판정 시험	Bump Film 특성시험
		열화상 온도측정 시험	COF Film 특성시험
		수질측정기 분해능 시험	출력전력 전력변환 효율시험
		정밀도 성능검증 시험	정밀도(HAV, HBV, HCV) 단일검출 시험
		박막 태양전지 전사장비에 대한 전사속도 시험	발전파장, 문턱전류 외 측정시험
		소모전력 시험	광센서 시스템 측정시험
Breakdown Voltage 시험	재밍주파수 대역 검증시험		

02 시험분석서비스 분야

한국센서연구소는 'Carbon Net Zero 2050'에 동참하고 있습니다.



분야	세부항목	
반도체 및 전기전자 제품 시험 서비스	다양한 시험 분석 서비스	인식용 시험 Microstrip Isolator 시험 표면 구조분석 시험
	가스센서 시험 분석	톨루엔 가스센서 시험 VOCs 가스센서 반응시험
화학가스 탐지시험 VOCs 가스센서 성능시험		
일산화탄소 가스센서 시험 환경의존성 시험(온도, 습도 변화)		
황화수소 가스센서 시험 소비전력 시험		
암모니아 가스센서 시험 반응속도/반응시간 시험		
오존 가스센서 시험 회복속도 시험		
타 가스 선택성 시험 감지범위 시험		
이산화질소 가스센서 시험 민감도 시험		
이산화탄소 가스센서 시험 수명 시험		
메탄 가스센서 시험 동작 온습도 측정시험		
메탈 가스센서 시험 포름알데히드 가스센서 시험		
광학식 복합 가스센서 시험 약취 감지 센서의 가스 농도 시험		
가연성 가스센서 측정시험 저항 변화율 시험		
반도체식 가스센서 시험 감도시험		
열전도도방식 가스센서 시험 소비전력 시험		
가스주입식 가스농도 측정시험 응답속도 시험		
전기화학식 가스센서 시험 크기측정 시험		
화학작용제 탐지농도 시험 분해능측정 시험		
MEMS 가스센서 시험 독성 센서 성능 평가		
에틸렌 가스센서 반응시험		
적외선 센서 시험	IR 카메라 측정 저주파노이즈 측정	
	소모전력 측정 신뢰성 시험	
	NEIT 특성 측정	
진동 및 압력 센서 시험	진동(가속도) 인가 시험 신호대비잡음 평가	
	진공 및 고압 압력 시험 반복성 평가	
	특성분석 및 저항분석 초음파 센서 공간 해상도 측정	
	민감도평가 CWDM DEMUX 초점거리 측정 시험	
음향 렌즈 Gain 시험		
지문 인식 센서 시험	지문 인식카드 성능시험 무전원 지문인식카드 시험	
	Shigella spp 30분 이내 양성확인 토양센서 토양 습도 시험	
바이오 센서 시험	Shigella spp 100 copies/rxn 양성확인 생체신호센서 성능 시험	
	비옥도 측정 정확도 시험 식중독균 유전자 통합 판별칩의 성능 시험	
	바이러스 센서 성능시험 DNA 증폭장치 성능 시험	
	생체신호감지모듈 센서 탐지 거리 시험 OECD 활성층 소재 성능 시험	
미세먼지 센서 시험	미세먼지 저감율 시험 MEMS 미세먼지 센서 시험	
	공기질 측정센서 시험 미세먼지 측정 정밀도 시험	
온도/습도 센서 시험	지하 온도 측정장치 시험 온습도센서의 성능 시험	
	면상발열체 신뢰성 시험	
이미지 센서 시험	이미지센서 성능시험 구강센서 시험	
	결합촬영장치의 감지 성능시험 색변환 센서 성능 시험	
지자기 센서 시험	3축 지자기센서 시험 펄스 장비 결합탐지율	
	자기장센서 성능 시험 자기센서 결합 검출 정확도 시험	
가속도 센서 시험	금속탐지센서 성능 시험 Hall Sensor에 대한 신뢰성 시험 전/후 특성 평가 시험	
	가속도 정밀도 시험 3축 인가 시험	
차량용 센서 시험	인가 진동 주파수 측정 시험	
	차륜센서모듈 신뢰성 평가 차량용 공기 청정기 성능시험	
	차량용 온습도 센서 시험	

한국센서연구소의 스마트한 융합·연결·속도가 명품을 만듭니다.

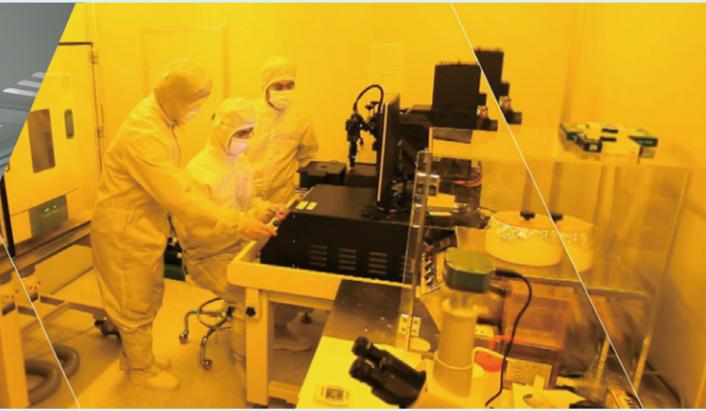


분야	세부항목	
첨단 센서 시험 분석 서비스	항법/관성 센서 시험	기울기 센서 정확도 및 신뢰성 평가 시험 관성센서 환경 시험 IoT 기반의 계측 시스템의 제어 속도 시험 관성센서 노이즈 시험 위치 정밀도 시험
	근접/감지 센서 시험	촉각센서의 신뢰성시험 근접 거리 정밀도 시험 경보 시스템 제품의 반복 신뢰성 시험
	알코올 센서 시험	에탄올 가스 센서 시험 알코올 농도 정밀도 시험
	pH 센서 시험	pH 정밀도 측정시험 pH 측정 범위 측정시험
		Data Sampling 측정시험 pH 센서 Drift 특성 시험
	철분 센서 시험	분해능 측정시험 동작속도 측정시험
		동작속도 측정시험 반복성 시험
	TFT 센서 시험	내진동성 측정시험
		신뢰성 시험 이동도 시험
	수소 센서 시험	센서 감지특성 시험 동작속도 측정시험
		신뢰성 시험 동작압력 측정시험
		감지범위 측정시험 농도측정 평가시험
		정확도 측정시험 타가스 선택성 시험
	불산 센서 시험	응답시간 측정시험 환경의존성 시험
		동작온도 측정시험 최종 용존수소 검출센서 압력 유지 시험
	시스템 속도측정시험	신뢰성 시험 검출감도 측정시험
		검출시간 측정시험 회복시간 측정시험
	토크 센서 시험 구분	센서 모듈 속도측정 시험 센서 장비 속도측정 시험
		고온특성(동작) 시험 저온특성(동작) 시험
	NDIR 센서 시험 구분	정확도 시험 소모전력 시험
조도/GPS 센서 시험	위치 정확도 성능시험 온도분해능/동작율/장파장대역 광반응 시험	
	PAR(광합성유효방사) 정확도 성능시험	
적외선 / 자외선 센서 시험	UV Sensor 온도 동작 시험 온도 정밀도 시험	
	마이크로볼로미터의 저주파노이즈 시험	
모션 센서 시험	유연 패키징 밴딩 신뢰성 시험 모션 인식 정확도 시험	
	모션 인식 반복성 시험	
조도 센서 시험	정상 광파워 응답특성 측정 4분할 일사센서의 Elevation Angle/Azimuth Angle/ FOV 시험	
	Photo Detector에 대한 Responsivity 시험	
수질 센서	인산염 센서의 성능시험	
음향/유량 센서 시험	R290 감도 시험 순간 최대 출력 밀도 시험	
CT X-Ray 디텍터 시험	고온저장 신뢰성 시험 열충격 신뢰성 시험	
	풍속 정밀도 시험 발전 전압 측정 시험	
풍속/풍력 발전 센서 시험	장시간 동작 신뢰성 시험	
자문/교육 서비스	반도체소자 개발 자문	반도체 소자 (다양한 요구조건)에 따른 개발 자문 다이오드, 캐패시터 등 수동소자 개발 자문 아날로그 반도체 개발 자문 인덕터, 저항 등 개발자문 차량용 반도체 개발 자문
	센서 개발 자문	MEMS 소자/센서 개발 자문 MEMS 소자/센서 성능향상이나 수율향상 자문
	바이오 소자/센서 개발 자문 바이오 소자/센서 성능향상이나 수율향상 자문	
회로 관련 개발 자문	통신 시스템 및 회로 관련 자문 고주파 회로 설계 자문	
	아날로그 시스템 및 회로 설계 자문	
교육	Device Physics 교육 국제 표준화 관련 자문 및 교육	
	반도체 및 센서 신뢰성 교육 KOLAS 인정 관련 자문 및 교육	

PART
II

연구개발서비스
전문기관

Be Innovation, Be No.1



01 반도체 WLR(Wafer Level Reliability) 서비스

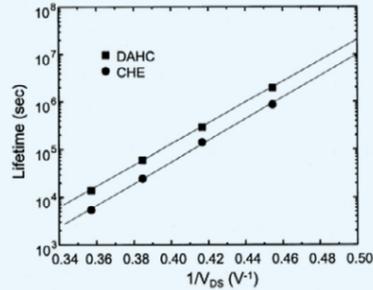
한국센서연구소는 국내유일의 WLR KOLAS 기관입니다.



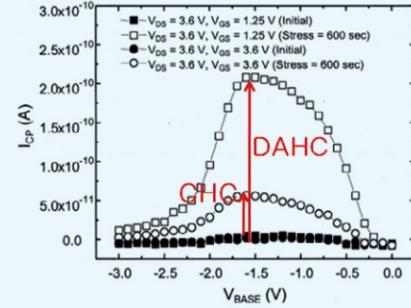
- 반도체 소자 개발시에 WLR 만족은 가장 중요한 항목 중의 하나임
- 반도체 소자의 WLR을 정확하게 평가하는 것이 매우 중요함

Hot Carrier

- Hot Carrier 수명 측정 분석
- DC와 AC Hot Carrier 분석
- Hot Carrier 열화 메커니즘 분석

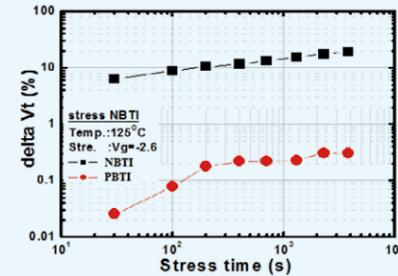


- CHC(Channel Hot Carrier)와 DAHC(Drain Avalanche Hot Carrier) 평가
- Hot Carrier 수명의 온도 의존성 분석

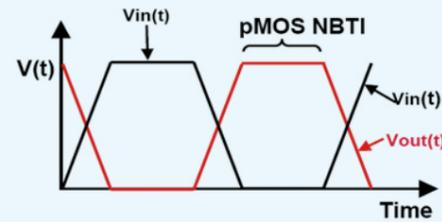


NBTI/PBTI

- NBTI(Negative Bias Temperature Instability)와 PBTI(Positive Bias Temperature Instability) 평가
- NBTI/PBTI 수명 측정 분석

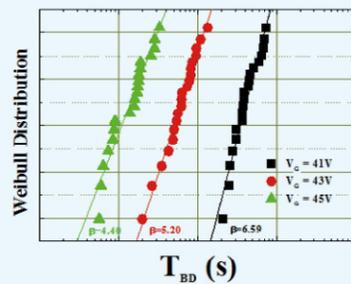


- DC와 AC Hot Carrier 분석 가능
- NBTI/PBTI 열화 메커니즘 분석
- NBTI/PBTI 수명의 온도 의존성 분석

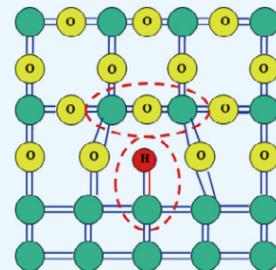


TDDB

- 반도체 소자의 Gate Dielectric 수명 평가
- 고용량 Capacitor의 수명 평가
- TDDB 수명 측정 및 분석



- TDDB 열화 메커니즘 분석
- TDDB 수명의 온도 의존성 분석

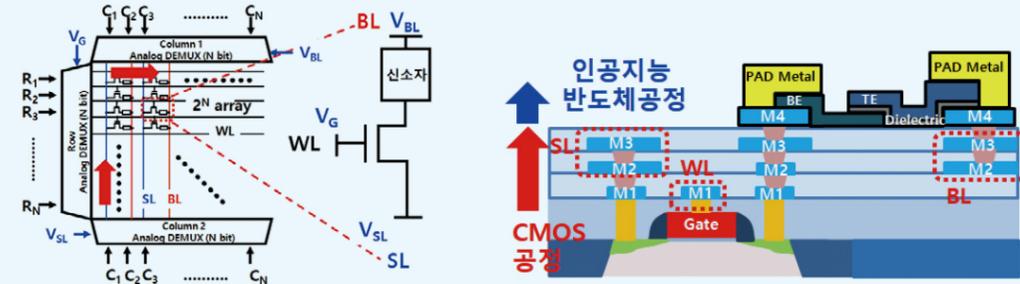


02 AI 반도체 TEG 서비스

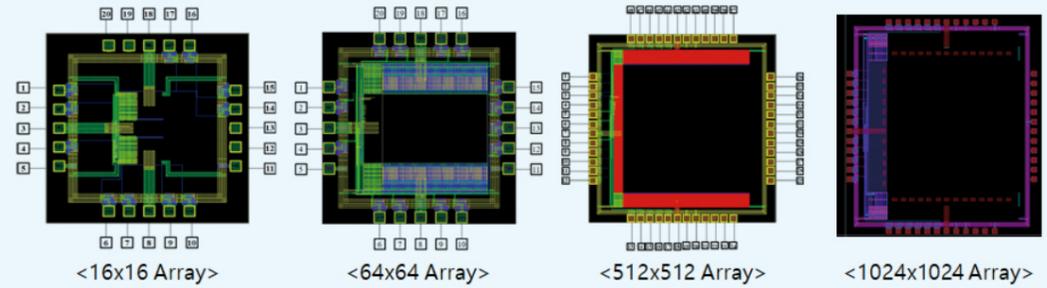
한국센서연구소는 10년 후의 미래반도체 기술을 연구합니다.



- 인공지능 반도체 개발을 위한 TEG(Test Element Group) 개발
- CMOS TEG가 집적된 플랫폼 서비스 제공
- CMOS가 형성된 웨이퍼 위에 인공지능반도체를 집적하여 인공지능 반도체 소자의 특성을 정확하게 평가

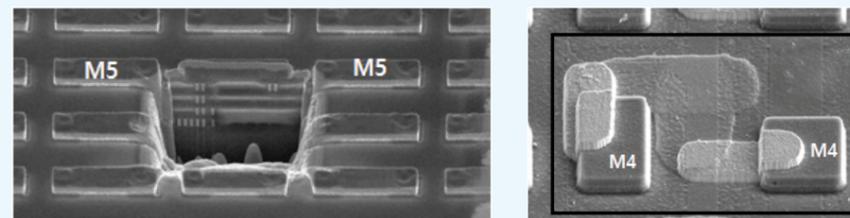


- 1T 1R 구조 뿐만 아니라 고속 Pulse 인가 TEG, 신뢰성 평가 TEG 등 다양한 TEG 활용 가능
- 16 x 16, 64 x 64, 512 x 512 의 다양한 크기의 인공지능 반도체 소자 Array의 신속하고 정확한 평가 가능
- 8인치 웨이퍼 뿐만 아니라 조각 웨이퍼에서도 인공지능 반도체 소자의 집적 가능



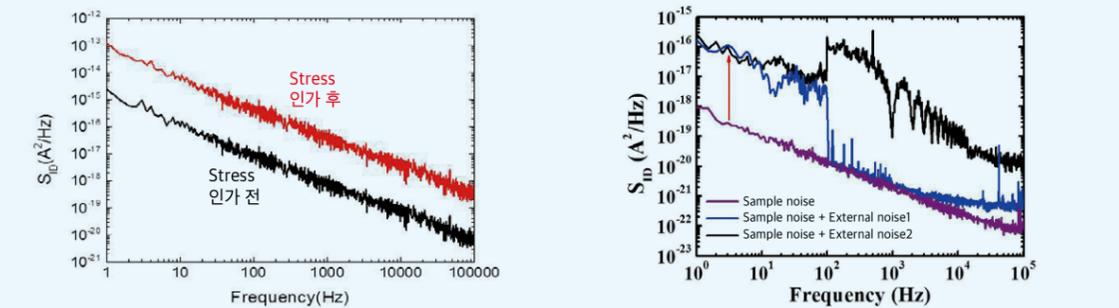
03 AI 반도체 공정서비스

- 인공지능 반도체 제작을 위한 공정 서비스 제공
- CMOS 공정 웨이퍼 위에 인공지능 반도체 소자 집적 공정 서비스
- 다양한 반도체 구조 제작 및 공정 서비스 제공



04 1/f noise 시험분석서비스

센서내의 1/f noise 를 저감시킬수록 성능이 향상됩니다.



- 첨단 센서의 성능은 저주파 노이즈에 의해 좌우됨
- 저주파 노이즈란 100 kHz 이하 저주파 영역에서 발생하는 노이즈임
- 센서의 동작 속도가 100 kHz 이하이기 때문에 저주파 노이즈가 센서의 성능을 좌우함
- 첨단 센서에서 저주파 노이즈를 저감시키면 센서의 특성이 매우 개선됨
- 센서의 동작 시간이 증가함에 따라 센서의 성능은 감소하는 반면에 저주파 노이즈는 증가하여 저주파 노이즈의 특성이 더욱 중요해짐
- 저주파 노이즈를 정확히 측정 분석하고 개선하는 것이 매우 중요함
- 1926년 미국 벨 연구소의 존슨 박사가 저주파노이즈 현상 발견, 우리나라는 미국 등 선진국에 비해 첨단 센서 및 반도체 개발에서 저주파 노이즈를 고려하는 것이 30년 이상 뒤쳐져 있음
- 한국센서연구소는 저주파 노이즈의 정확한 시험 분석 및 개선을 진행하고 있음

05 세계최초개발, GOODSEN

GOODSEN은 트릴리온 센서시대의 필수장비입니다.



굿센의 편리한 시험분석기능 Five

- I 전압-전류 특성 분석**
 - 첨단센서 및 반도체의 전압에 따른 전류 특성 분석
 - 4개 채널의 SMU를 이용하여 각종 파라미터 추출
- II 1/f noise 특성 분석**
 - 첨단센서 및 반도체의 저주파 노이즈(1/f noise) 특성 분석
 - 자동으로 1/f noise 측정 후 Pass/Fail 평가 및 판별 가능
- III RTS noise 특성 분석**
 - 첨단센서 및 반도체의 RTS noise 특성 분석
 - 자동으로 RTS noise 측정 후 Pass/Fail 평가 및 판별 가능
- IV 신뢰성 분석**
 - Stress에 따른 전압-전류 및 1/f noise, RTS noise의 변화 분석
 - Stress 인가 전후 변화를 정확히 측정하여 제품수명(신뢰성) 예측 가능
- V Time to Failure 분석**
 - 첨단센서 및 반도체의 Time to Failure 특성 분석
 - 절연막 및 배선의 TTF와 신뢰성 시험 분석



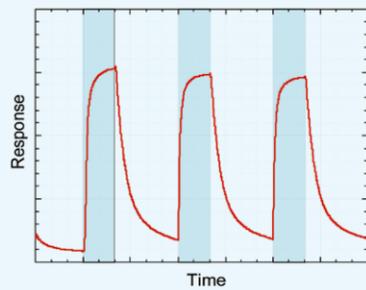
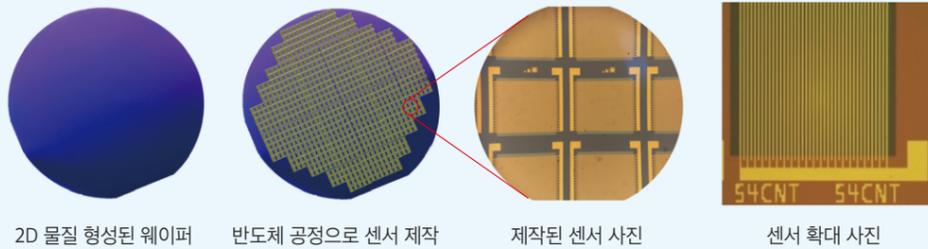
06 스마트센서 국산화

한국센서연구소는 미래기술혁신 기업입니다.

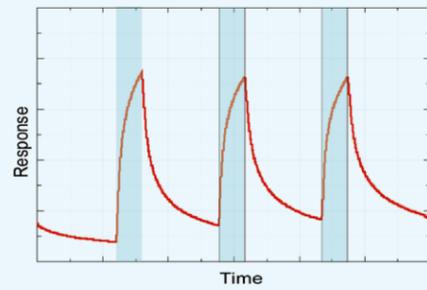


가스센서 감지부

- 고품질 칼코지나이드계 MoS₂ 및 WS₂ 2D 물질 형성
- 대면적 (4인치 웨이퍼) 고균일 나노 소재 합성 기술 개발
- IoT에 적합한 초소형·초저전력 상온동작 NH₃ 및 NO₂ 가스 센서 개발
- 반도체 공정으로 가스 센서의 대량 생산 체제 구축
- 상온동작·초저전력 가스센서 개발



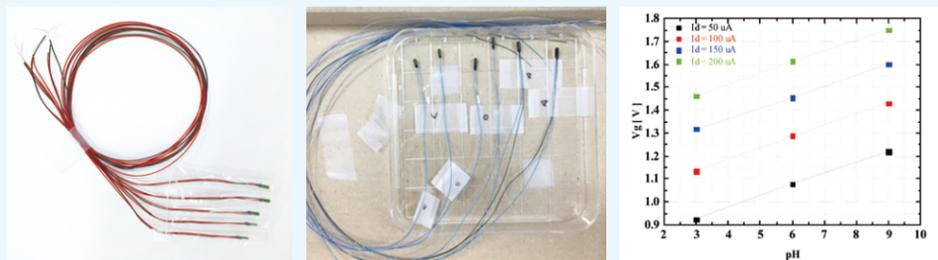
MoS₂ 센서의 NH₃ 반응 특성



WS₂ 센서의 NO₂ 반응 특성

pH센서 감지부

- 반도체 방식의 ISFET으로 다양한 용도에 사용 가능
- 인후두 등 인체 내에 사용 가능한 pH 감지부 개발 완료
- 크기가 1 mm 내외로 매우 작아 미세한 틈에서 사용 가능
- 기존 유리 구조를 갖는 pH 센서와 달리 충격에 매우 강하여 돌이나 금속 재질 내에서도 사용 가능함
- 낮은 노이즈 전류 특성으로 고정밀 pH 측정 가능



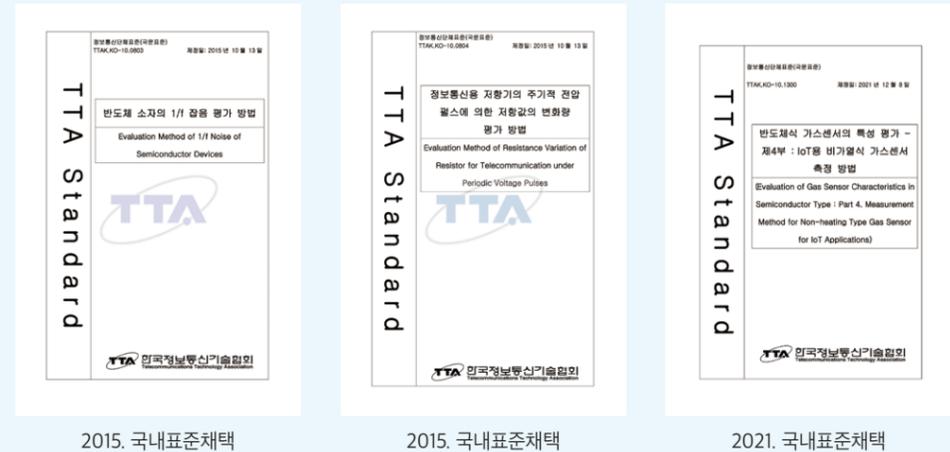
07 스마트센서 표준화

한국센서연구소 기술이 국내표준에 채택되고 있습니다.



당사의 국내표준 제안 및 채택

- 2015 반도체 소자의 1/f noise 잡음 평가 방법
- 2015 정보통신용 저항기의 주기적 전압 펄스에 의한 저항값의 변화량 평가 방법
- 2021 반도체식 가스센서의 특성평가 - 제4부 : IoT용 비가열식 가스센서 측정 방법

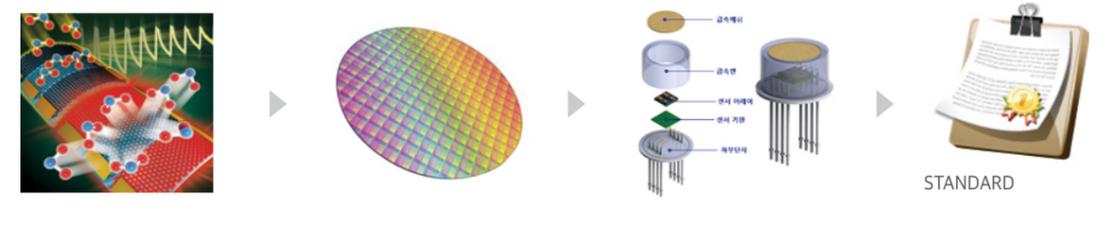


IoT용 비가열식 가스센서 측정방법

- 사물인터넷(IoT) 및 소물인터넷(IoST)의 핵심은 초저전력 동작임
- 초저전력 가스 센서의 특성을 정확하게 평가할 수 있는 표준 제안 및 채택
- 히터가 없는 반도체식 가스센서의 특성을 정확하게 측정할 수 있는 표준임
- 가스 센서 핵심 기술에 대한 표준 제안이 가능한 수준 높은 기술 보유
- 표준에 기반한 다양한 가스센서 시험분석 서비스 제공



상용화를 위한 가스 센서 개발 및 성능평가 기술의 표준화

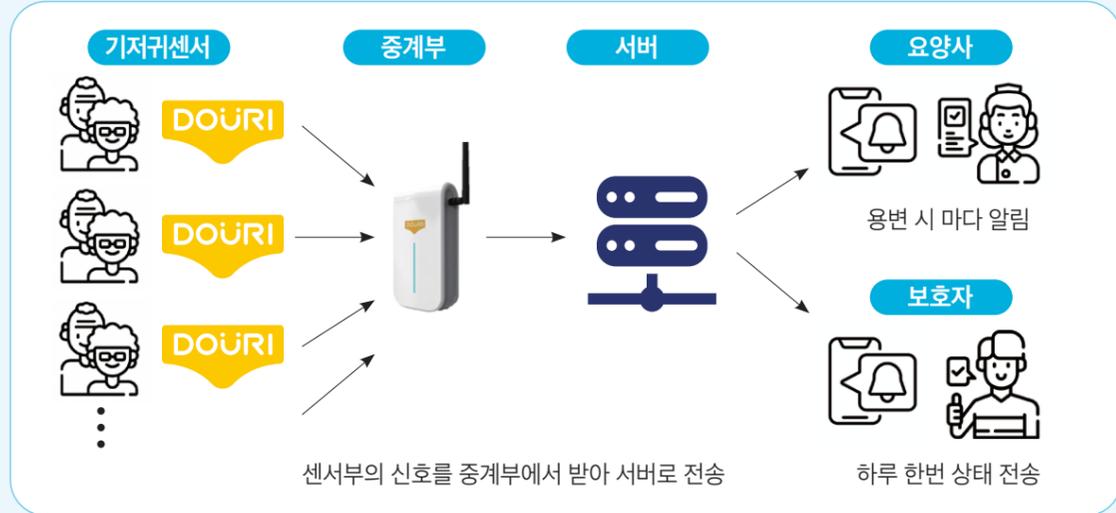


08 스마트센서 제품화

DOURI는 사람을 아름답게 지켜주고 세상을 아름답게 바꿀 겁니다.



도우리: '도와주다'의 순 우리말 초저전력 스마트 기저귀 센서 및 사회적 노인돌봄 시스템



2023년 4월 노산 선크림요양원 방문

실문지(노인용)	실문지(요양보호사용)	실문지(보호자용)
<p>1. 실문지(노인용) 사용 목적</p> <p>2. 실문지(노인용) 사용 방법</p> <p>3. 실문지(노인용) 사용 주의사항</p> <p>4. 실문지(노인용) 사용 유의사항</p>	<p>1. 실문지(요양보호사용) 사용 목적</p> <p>2. 실문지(요양보호사용) 사용 방법</p> <p>3. 실문지(요양보호사용) 사용 주의사항</p> <p>4. 실문지(요양보호사용) 사용 유의사항</p>	<p>1. 실문지(보호자용) 사용 목적</p> <p>2. 실문지(보호자용) 사용 방법</p> <p>3. 실문지(보호자용) 사용 주의사항</p> <p>4. 실문지(보호자용) 사용 유의사항</p>



한국센서연구소는 TRL1~TRL9까지 R&BD 전주기에 도전합니다.



TRL(Technology Readiness Level)은 기술성숙도를 의미함

09 스마트센서 플랫폼화

한국센서연구소는 신기술로 신제품 플랫폼화를 선도합니다.

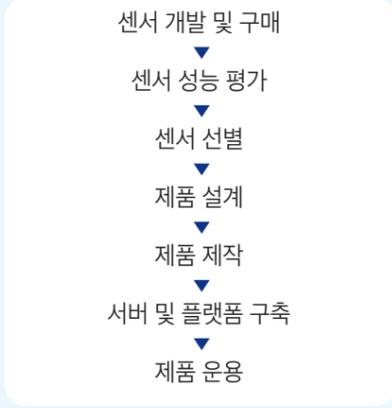


Plasmon = Plasma + Monster

플라즈마 저온저장고의 신선도 유지를 도와주는 착한 몬스터
저장고 내부의 저온고습 복합가스 환경 조건을 고려한 모니터링 시스템
작물의 살균, 부패, 건조 및 노화 방지를 도와주는 IoT 복합센서장비



한국센서연구소의 스마트센서 플랫폼 개발 Process



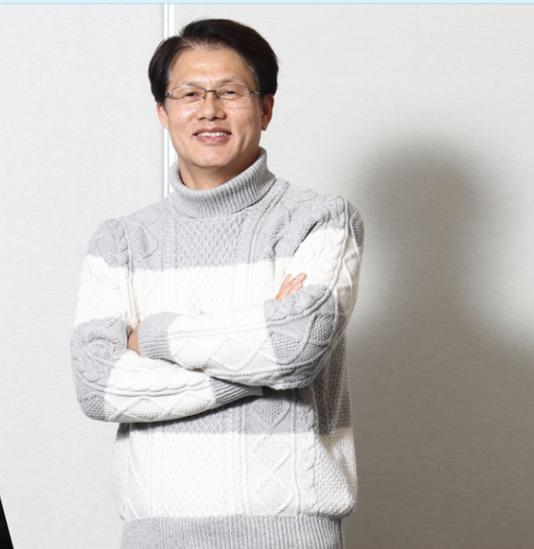
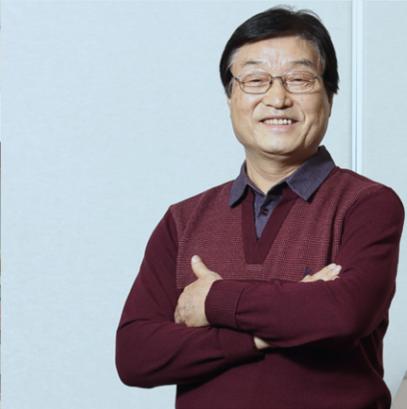
2022 패밀리기업 협약식



PART

III

우리들의 이야기



01 대표이사 인사말

한국센서연구소는 ESG 경영을 실천하고 있습니다.



CEO 이수민 Ph.D.
 이화여대 정치학 박사
 서울대경영대학원 AMP 92기 부회장
 서울대경영대학원 ESG최고위 1기 부회장
 (사)한국과학기술정책연구회 부회장
 한국센서학회 부회장 / 대한전자공학회 이사
 2019 자랑스러운 한국인 대상
 2020 과학기술정보통신부 장관상
 2021 장영실상 공동수상
 2023 국무총리상 표창

사랑하는 고객여러분, 안녕하십니까?

올해로 창립 11주년을 맞이한 한국센서연구소는 고객님의 애정과 신뢰를 바탕으로 꾸준히 성장하였습니다. 반도체 및 첨단센서 시험분석 서비스와 상품을 경험한 고객님들이 만족하며 웃는 모습, 임직원들과 상담하고 돌아서면서 환하게 웃는 모습을 보면서 고객님이 말하지 않은 것까지 세심히 살피기 위해 쉬지 않고 고민했던 시간들이 매우 소중하게 느껴집니다.

한국센서연구소는 가장 먼저 고객을 생각하기에 고객님이 느끼는 특별한 감동을 전하고자 끊임없이 연구합니다. 고객님의 기대 수준을 뛰어넘는 우수한 기술력과 고품질 서비스를 독창적이고 차별화된 가치로 전하기 위해 임직원들이 고객님과 함께 달리고 있습니다.

비메모리반도체 및 센서의 신뢰성이 국내시장에 반드시 필요하다는 생각으로 기업을 창업하였던 10년 전이 떠오릅니다. 4차 산업 혁명과 코로나19, 인공지능, 차세대 반도체, 6G, 미래 모빌리티 등이 등장하면서 그 도전이 옳은 선택이었고, 미래에 대한 준비였음을 느낍니다. 트릴리온(Trillion) 센서시대에 모든 것이 스마트하고 지능적인 메타센서, 다양한 사물들이 센서를 통해 감각을 얻는 초소형 고감도 센서들의 등장은 상상하기 힘들 정도의 세상을 만들어가고 있습니다. 한국센서연구소는 센서를 통해 사람과 사람을 연결하고 세상을 안전하고, 편리하고, 따뜻하게 변화시킨다는 비전을 세우며 지속가능한 성장을 꿈꾸고 있습니다.

미래는 언제나 빨리 다가올 뿐만 아니라 때론 예측하지 못하는 방식으로 다가옵니다. 우리 모두는 융합을 통해 새로운 패러다임을 선도해야 합니다. 한국센서연구소는 긴밀한 협업을 통해 핵심을 중심으로 보고하는 보고문화, 모든 구성원이 참여하는 스마트한 회의문화, 구성원과 회사가 함께 전문가로 성장하는 학습문화를 만들어가고 있습니다. 임직원의 창의성이 발휘되도록 인간 중심 경영을 원칙으로 하며, 이러한 원칙을 소외된 이웃에게도 동등하게 적용하여 따스한 정을 나누는 나눔 활동으로 이어가고 있습니다. 인성 좋은 직원이 실력 높은 직원보다 비교우위에 있는 것처럼, 기업도 윤리경영을 통해 모두가 상생하는 차원 높은 성장을 이루고 사회적 책임을 다하는 역할이 필요한 시대입니다. 한국센서연구소는 앞으로도 10년, 50년, 100년 고객님께 더욱 사랑받고 신뢰받는 기업이 되도록 최선을 다하겠습니다. 여러분 가정에 언제나 사랑과 행복과 만복이 가득하시길 진심으로 기원합니다. 감사합니다.



한국센서연구소 대표이사 이수민 배상

02 회사 성장 일기: 연혁 및 수상실적

여성 CEO의 섬세함과 창의성으로 새로운 가치를 만들어가고 있습니다.



<p>12.10 스타트업 창업</p>	<p>13.01 벤처기업등록</p>	<p>14.02 KOLAS 국제공인시험기관</p>	<p>15.03 기업부설연구소</p>	<p>15.08 연구개발 서비스업</p>
<p>18.08 CEO 청렴대상</p>	<p>17.07 기술전문기업</p>	<p>17.05 우주용 부품시험</p>	<p>16.12 항공기술연구소 MOU</p>	<p>16.06 한국센서학회 MOU</p>
<p>19.04 국방벤처기업</p>	<p>19.09 자랑스러운 한국인대상</p>	<p>19.10 유망중소기업선정</p>	<p>19.11 일하기좋은 중소기업</p>	<p>19.12 대통령상표창</p>
<p>21.10 대한민국신기술대상 3년연속상</p>	<p>21.08 발전기금전달</p>	<p>21.02 이노비즈선정</p>	<p>20.12 과기정통부장관상</p>	<p>20.09 대한민국신기술대상 1/f noise</p>
<p>21.10 굿센KC인증</p>	<p>21.11 장영실상수상</p>	<p>22.02 스마트팩토리</p>	<p>22.08 신용등급우수기업</p>	<p>22.10 창립10주년</p>
<p>2030 수출의 탑 선정</p>	<p>2025 매출의 탑 수상</p>	<p>To Be</p>	<p>23.10 세계표준의 날 국무총리상 한국센서학회 기술진보상</p>	<p>23.08 대한민국굿기술대상 5년연속상</p>

03 KOLAS 임원 인사말

한국센서연구소는 KOLAS 최고의 전문가들로 구성되어 있습니다.



이희덕 CTO Ph.D.

한국센서연구소 KOLAS 기술책임

현) 충남대학교 공과대학 전자공학과 교수, BK단장
전) 충남대학교 공학혁신센터장, 창업보육센터장
카이스트 전자공학 Ph.D.

안녕하십니까?

한국센서연구소는 우수벤처기업, 연구개발서비스기업, 유망중소기업, 이노비즈기업 등 해를 거듭할수록 날이 성장하고 있습니다. 트릴리온(Trillion) 센서 시대를 맞이하여, 창업 때부터 다양한 센서 및 반도체 성능과 신뢰성을 담당해온 한국센서연구소는 그 역할과 책임이 더욱 중요해지고 있습니다. 우리는 지속 가능한 발전과 미래 먹거리를 위해서 첨단 R&D 결과물의 상용화가 절실히 요구되는 시대에 살고 있습니다. 이에 저는 30년 이상 시스템반도체 연구 개발에 몰두하여 확보한 최첨단 기술의 Know-How를 단순히 상아탑 안에만 가둬두지는 않겠습니다. 해외의 대학처럼 산학협력을 통해 연구개발 기획부터 사업화, 글로벌화에 이르기까지 세계적으로 우수한 산학협력 모델을 만들겠습니다. 무엇보다 혁신적인 기술개발을 통해 도전적이고 열정적인 자세로 대한민국 비메모리 반도체 및 첨단센서 분야 기술발전에 기여함으로써 우리나라가 미래 차세대 반도체와 첨단센서 강국이 되도록 노력하겠습니다. 여러분의 가정에 행복과 웃음이 가득하시길 기원합니다. 감사합니다.

CTO 이희덕 배상

- 2018 산업통상자원부 장관상
- 2019 대통령상 수상
- 2020 충남대 총장상(우수교수)
- 2021 장영실상 공동수상



김국진 CQO Ph.D.

한국센서연구소 KOLAS 품질책임

현) 안전보건관리자
전) 한국표준과학연구원 펄스라 팀장
경북대 전자공학 Ph.D.

안녕하십니까?

한국센서연구소는 인체의 오감과 같은 다양한 센서들을 시험분석하는 KOLAS 국제공인 시험기관입니다. KOLAS 운영기관에 적합한 공정성 선언과 품질방침을 운영하고 있으며, “고객만족 100%, 부적합 0%”를 위해 오늘도 모든 구성원들은 품질관리에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 4차 산업 혁명 시대의 능동적인 변화에 대처하고자 KOLAS 품질관리 시스템을 스마트팩토리와 접목하였으며, 신뢰받는 한국센서연구소로 성장하기 위해 새로운 품질경영에 도전하고 있습니다. 미래의 차세대 반도체 및 센서 시험분석뿐만 아니라 센서의 기술표준화와 제품국산화를 선도하는 한국센서연구소에 언제든지 방문하여 주시면 감사하겠습니다.

CQO 김국진 배상

은창수 KOLAS 기술/품질 부책임

현)충남대학교 공과대학 전파정보통신공학과 교수
전) 충남대학교 산학협력 부단장
UT Austin 전기공학 Ph.D.

장경호 KOLAS 전문위원

현) KOLAS 평가사
전) 한국표준과학연구원 책임연구원
숭실대 물리학 석사

04 조직도 및 회사비전

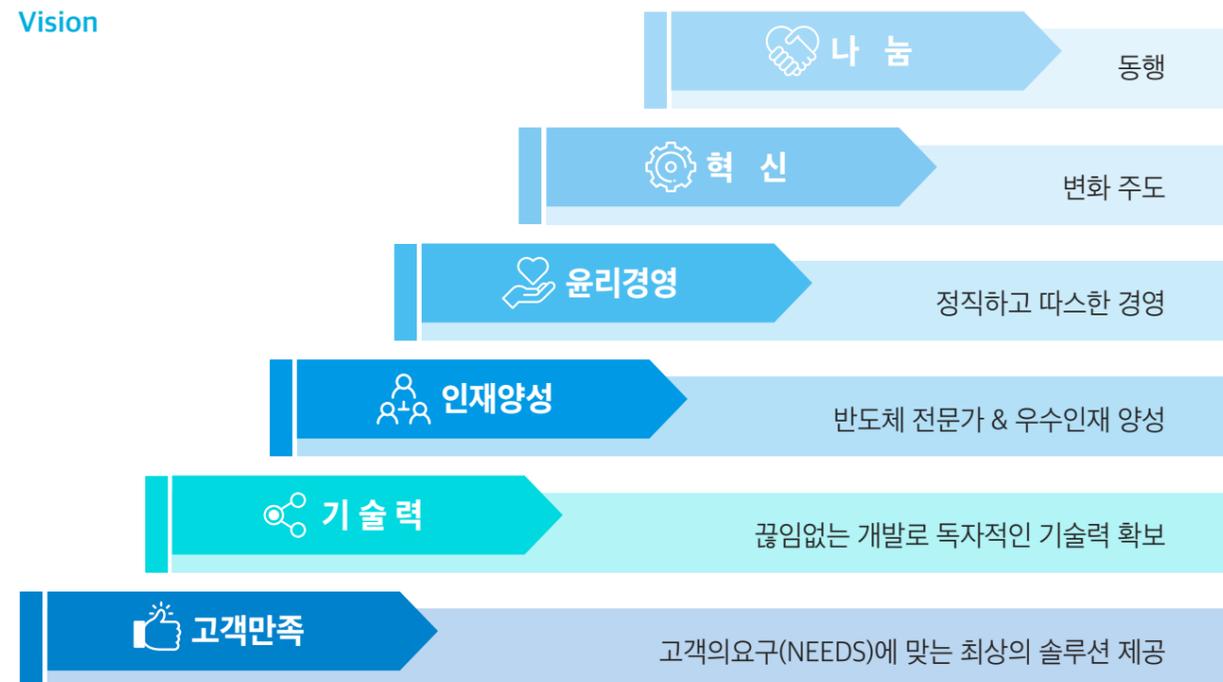
한국센서연구소는 변화를 선도하는 연구중심 기업입니다.



조직도



Vision



05 따스한 동행 : 우리들의 이야기

한국센서연구소는 꿈을 꾸고 꿈을 이루는 기업입니다.



Y 프로님

센서성능의 최강자!
머지않아 좋은 센서의 기준은
한국센서연구소의 성적서가
될 것입니다.

E 전문위원님

정직과 신뢰의 가치를 실현하는
한국센서연구소가 국내 센서산업
발전의 초석이 되길 희망합니다.
아울러 소논문 형식으로 발급하는 고품질
성적서가 국내외 다양한 고객들에게
신뢰를 받고 있는 만큼 KOLAS 정신을
높이는 기업으로 자리매김하길
기대해봅니다.

P 프로님

앞으로가 기대되는
회사입니다.

J 전문위원님

KOLAS의 기본정신인 공정성과
신뢰성 그리고 정확한 시험결과를
제공하는 것을 경영철학으로 간직하는
한국센서연구소는 일취월장할 것으로
기대합니다. KOLAS 인정 획득 후
8년간 매주 KOLAS 회의를 열고
현장과 소통하려는 진지한
모습이 매우 인상 깊은
기업입니다.

L 프로님

독특한 색깔을 가지고
차별화된 서비스를 제공하며
앞으로의 성장이 기대되는
회사입니다.

N 프로님

KOLAS 규정과
기술 전문성을 바탕으로
정직한 성장을 해나가고 있어,
배울점이 많은
기업입니다.

K 프로님

한줄평으로 담기엔
너무 큰 회사입니다.

C 프로님

앞으로 시스템
반도체에 있어서
매우 큰 기대가 되는
회사입니다.

J 프로님

산업 흐름에 한 발짝 앞서가는
기민한 토끼 같은 기업입니다.
직원들의 성장을 매우 장려하고 있으며,
실제로 배울점도 많아
매일 감사하게 배우고 있습니다.

S 프로님

센서의 기술 발전에 따라
센서의 성능을 높여주는
저주파 노이즈 측정,
Wafer Level 반도체 소자
신뢰성 시험 등 여러 시험을 통해
성장할 수 있는
미래 유망 기업입니다.

06 외부 전문위원 (since 2022)

최고의 외부전문가들이 한국센서연구소와 동행하고 있습니다.



이주진 전문위원

전) 한국항공우주연구원 원장
전) 한국과학기술정책연구회 회장
서울대졸, 존스홉킨스 기계공학 Ph.D.



정연호 전문위원

전) 한국원자력연구원 원장
전) 한국과학기술정책연구회 회장
서울대졸, NCSU 원자핵공학 Ph.D.

현실로 다가오는 자율주행, AI, 우주항공시대에 기본 핵심이되는 IoT 센서 및 반도체 등에 대한 국내 유일한 기술중심 기업입니다. 더불어 이 분야 자가 테스트를 할 수 있는 세계 최초의 장비도 개발하고 있는 미래 기업으로 성장하고 있습니다. 우리나라가 육성해야 할 기술중심의 세계적 강소기업으로 발돋움할 것으로 믿고 있습니다.

지금까지 성공적으로 쌓아온 이수민 대표의 치밀하면서 대담한 기술개발전략은 센서기술고도화로 세상을 이롭게 하고자 하는 원대한 꿈을 이루는 바탕이 될 것입니다.



이현규 전문위원

전) 한국원자력통제기술원 원장
전) 한국과학기술총연합회 사무총장 외 다수
서울대졸, 카이스트 전기전자공학, 기술고시



박호덕 전문위원

전) 구미전자정보기술원 원장
전) 한국센서학회 회장
경북대 전자공학(반도체공학) Ph.D.

단아한 외모에 언제나 친근감을 느끼게 하는 따뜻한 커리어우먼입니다. 그러나 일을 대할 때는 감추어져 있는 강인함이 드러나는 것이 매력입니다. 정치학을 전공했으면서도 이공계 첨단 과학기술 분야에 도전하는 여성 CEO, 두 아들의 엄마로서 새로운 미래를 개척하는 모습을 대할 때면 내면의 강인함이 없이 불가능함을 느낍니다.

인간의 오감과 감성이 센서에 담겨 세상을 편리하게 하는 시대, 센서산업의 발전에 한국센서연구소가 마중물 역할을 할 것을 기대합니다. 우리나라 센서산업 생태계에 지금도, 앞으로도 꼭 필요한 한국센서연구소가 될 것이라고 확신합니다.



정교일 전문위원

전) 한국디지털포렌식학회 회장
현) 한국전자통신연구원, 책임연구원
한양대 전자공학 Ph.D.



이창훈 변호사

현) 법무법인 신광
현) 서울시 공익변호사단
고려대 법학사

지능정보사회의 핵심인 센서의 중요도가 점차 높아지고 있는 시기에 센서의 성능에 대한 검증은 반드시 필요합니다. 한국센서연구소는 이의 성능 확인을 위해 중요한 역할을 다할 것으로 생각합니다.

청렴하고 이웃을 돌아볼 줄 아는 CEO, 정직하고 능력있는 CTO, 열정적이고 성장하는 직원들 모두 삼위일체가 되어 발전하는 한국센서연구소와 함께 할 수 있어서 행복합니다.

07 따스한 동행 : 이웃사랑

한국센서연구소는 이웃사랑을 실천합니다.



충남대학교 장학기금 전달



사랑의 연탄나눔



1회용품 줄이기



국경없는 의사회 후원



굿네이버스 후원

08 기업을 돕는 기업

한국센서연구소의 1℃와 기업의 99℃가 만나 끓는 물이 됩니다.



| 중소벤처기업부 연구기반 활용플러스사업(운영기관) |



사업목적

- 운영기관 한국센서연구소가 보유한 연구장비 및 기술서비스에 대한 공동활용 지원



지원대상

- 중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 중소기업



지원내용

- 연구개발을 목적으로 대학, 연구기관 등의 주관기관이 보유한 연구장비를 활용하는 중소기업에게 온라인 바우처(쿠폰) 방식으로 장비이용료(시험수수료) 지원

구분	정부출연금(80%)	기업부담금(20%)	바우처 발행 한도
기업선도형	10,000천원	2,500천원	12,500천원
기반플러스형	50,000천원	12,500천원	62,500천원

* 바우처 신청 > 바우처 승인 > 기업부담금 납부 > 바우처 발행

| KOLAS 및 신뢰성 지원사업(공급기관) |



사업목적

- 나노분야 기업 제품이 수요기업과 사업화 과정에서 발생하는 수요기업 요구의 KOLAS 공인인증기관(한국센서연구소) 시험성적서 및 신뢰성 평가 지원



지원대상

- KOLAS 국제공인시험기관(한국센서연구소) 시험성적서를 필요로 하는 대전시 소재 중소·벤처기업



지원내용

- KOLAS 국제공인시험기관(한국센서연구소) 시험성적서 및 신뢰성 평가 수행에 직접적으로 소요되는 비용을 지원

구분	정부지원금	기업부담금
공인시험/제품인증 지원	총 소요비용의 75% 이내 (최대 2천만원)	총 소요비용의 25% 이상
해외인증	총 소요비용의 75% 이내 (최대 3천만원)	총 소요비용의 25% 이상
신뢰성평가 지원	총 소요비용의 75% 이내 (최대 1천만원)	총 소요비용의 25% 이상



문의

- 대표전화 042-936-5361 담당자 010-2978-5361
- 메일 support@ksensor.co.kr 홈페이지 www.ksensor.co.kr

* 이 외 다양한 KOLAS 인증 및 신뢰성 지원사업들이 있습니다.